

CONFOCAL MICROSCOPE

Patent Number: JP11133306
Publication date: 1999-05-21
Inventor(s): TANAAMI TAKEO; TERAOKA SUSUMU
Applicant(s): YOKOGAWA ELECTRIC CORP
Requested Patent: ☐ JP11133306
Application Number: JP19970296637 19971029
Priority Number(s):
IPC Classification: G02B21/00; G02B26/10
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a confocal microscope constituted so that a sample placed at an optional position can be observed by using an optical fiber bundle.

SOLUTION: The confocal microscope is constituted so that the image on a sample surface can be observed by scanning the sample surface with an optical beam by using a confocal optical scanner. Besides, it is provided with the flexible optical fiber bundle optically coupling between the confocal optical scanner and an objective lens 7. Then, the core diameter of optical fiber constituting the optical fiber bundle is set to be $\geq 1/2$ and \leq double of the diameter of an optical beam irradiating the end surface of the optical fiber bundle from the very small aperture part of the confocal optical scanner.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-133306

(43) 公開日 平成11年(1999) 5月21日

(51) Int.Cl.⁸

G 0 2 B 21/00
26/10

識別記号

F I

G 0 2 B 21/00
26/10

Z

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平9-296637

(22) 出願日 平成9年(1997)10月29日

(71) 出願人 000006507

横河電機株式会社

東京都武蔵野市中町2丁目9番32号

(72) 発明者 田名網 健雄

東京都武蔵野市中町2丁目9番32号 横河
電機株式会社内

(72) 発明者 寺川 進

浜松市半田町3600 浜松医科大学 光量子
医学研究センター内

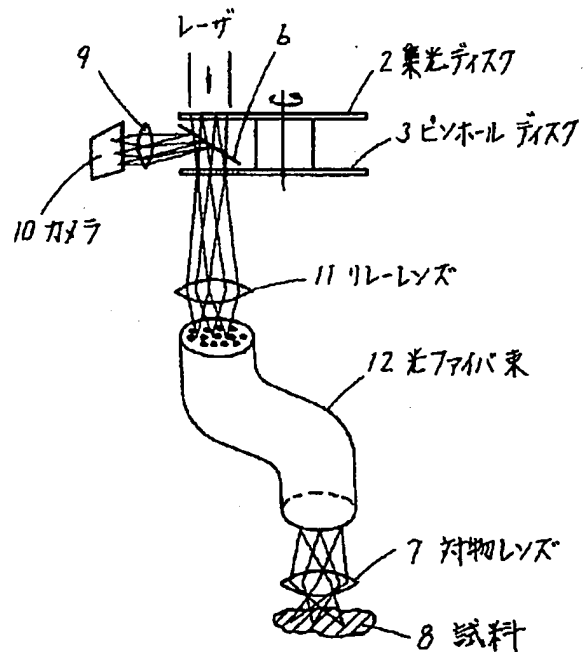
(74) 代理人 弁理士 東野 博文

(54) 【発明の名称】 共焦点顕微鏡

(57) 【要約】

【課題】 光ファイバ束を用い、任意位置の試料を観測することのできる共焦点顕微鏡を実現する。

【解決手段】 共焦点用光スキャナを用い試料面を光ビームで走査し試料面の像を観察することができるようにした共焦点顕微鏡において、共焦点用光スキャナと対物レンズとの間を光学的に結合する可撓性の光ファイバ束を備え、この光ファイバ束を構成する光ファイバのコア径を、前記共焦点用光スキャナにおける微小開口部から光ファイバ束の端面上に照射された光ビーム径の半分以上かつ2倍以下とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】共焦点用光スキャナを用い試料面を光ビームで走査し試料面の像を観察することができるようにした共焦点顕微鏡において、

前記共焦点用光スキャナと対物レンズとの間を光学的に結合する可撓性の光ファイバ束を備え、

この光ファイバ束を構成する光ファイバのコア径を、前記共焦点用光スキャナにおける微小開口部から光ファイバ束の端面上に照射された光ビーム径の半分以上かつ2倍以下としたことを特徴とする共焦点顕微鏡。

【請求項2】前記共焦点用光スキャナは、多数の微小開口部を有するディスクを回転させて光ビームを走査するように構成されたことを特徴とする請求項1記載の共焦点顕微鏡。

【請求項3】前記微小開口部がピンホールまたはスリットであることを特徴とする請求項1または2記載の共焦点顕微鏡。

【請求項4】前記共焦点用光スキャナは前記ディスクの微小開口部に入射する光を集束するマイクロレンズが配設された集光ディスクを備えたことを特徴とする請求項2記載の共焦点顕微鏡。

【請求項5】前記光ファイバ束と試料の間に、ホルダに収納され光軸方向に移動可能な対物レンズを持つことを特徴とする請求項1記載の共焦点顕微鏡。

【請求項6】前記ホルダは、試料と対物レンズの間に、試料と密着可能な光学窓を持つことを特徴とする請求項1記載の共焦点顕微鏡。

【請求項7】前記光ファイバ束には観察用以外の光も同時に入射するようにしたことを特徴とする請求項1記載の共焦点顕微鏡。

【請求項8】前記観察用以外の光は観察用の光と波長が異なる光であることを特徴とする請求項7記載の共焦点顕微鏡。

【請求項9】前記共焦点用光スキャナと光ファイバ束の間にリレーレンズを設け、このリレーレンズと前記光ファイバ束を構成する光ファイバの開口数を実質上等しくしたことを特徴とする請求項1記載の共焦点顕微鏡。

【請求項10】前記共焦点用光スキャナの微小開口部に前記光ファイバの端面を接近して配置したことを特徴とする請求項1記載の共焦点顕微鏡。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【発明の属する技術分野】本発明は、共焦点顕微鏡に適用される共焦点用光スキャナ装置に関し、特に光ファイバ束を用いた共焦点用光スキャナ装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来より共焦点顕微鏡に使用される共焦点用光スキャナはよく知られており、例えば本願出願人が出願した特開平5-60980号「共焦点用光スキャ

ナ」には、図11に示すような構成の共焦点光スキャナが記載されている。

【0003】図示の共焦点用光スキャナ1では、集光ディスク2およびピンホール・ディスク3がドラム4を挟んで平行に連結され、モータ5によって回転するように形成されている。更に、2つのディスク2、3の間にはビームスプリッタ6が固定配置されている。

【0004】集光ディスク2には複数のマイクロレンズ（例えばフレネルレンズ）が形成され、ピンホール・ディスク3には複数のピンホールが形成されており（このようなピンホール・ディスクとしては例えばニボウディスク方式のものがある）、各マイクロレンズの焦点位置に各ピンホールが位置するように2つのディスクが連結されている。

【0005】なお、ピンホール・ディスク上の多数のピンホールは、共焦点効果を得るために、互いにピンホール径の5～10倍程度離して配置されている（以下ではこのピンホール間のピッチをPとする）。

【0006】集光ディスク2に入射するレーザ光はマイクロレンズで絞られ、ビームスプリッタ6を透過してピンホールに集光する。ピンホールを通った光は対物レンズ7により集光され、試料8上に照射される。試料8からの戻り光は再び対物レンズ7およびピンホール・ディスク3を通してビームスプリッタ6で反射され、集光レンズ9を介してカメラ10に入る。カメラ10の受像面（図示せず）には試料8の像が結像される。

【0007】このような構成において、集光ディスク2とピンホール・ディスク3を回転させ、複数のピンホールにより試料8面を光走査することにより、カメラ10により試料8の表面画像を観測することができる。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】ところで、このような従来の共焦点顕微鏡では光スキャナと試料8との位置関係が常に固定であり、内視鏡やハンディ顕微鏡等のように任意の位置にある試料を観測できるような構造にはなっていない。共焦点顕微鏡で任意の位置にある試料を観測できれば、極めて便利である。

【0009】本発明の目的は、このような点に鑑み、光ファイバ束を用い、任意位置の試料を観測することのできる共焦点顕微鏡を実現しようとするものである。

【0010】

【課題を解決するための手段】このような目的を達成するために、請求項1に記載の発明では、共焦点用光スキャナを用い試料面を光ビームで走査し試料面の像を観察することができるようにした共焦点顕微鏡において、前記共焦点用光スキャナと対物レンズとの間を光学的に結合する可撓性の光ファイバ束を備え、この光ファイバ束を構成する光ファイバのコア径を、前記共焦点用光スキャナにおける微小開口部から光ファイバ束の端面上に照射された光ビーム径の半分以上かつ2倍以下としたこと

を特徴とする。

【0011】

【発明の実施の形態】以下図面を用いて本発明を詳しく説明する。図1は本発明の共焦点顕微鏡の一実施例を示す構成図である。図1において図11と同等部分には同一符号を付し、その説明は省略する。

【0012】図1において図11の構成と異なるところは、共焦点光スキャナ1と対物レンズ7との間を光ファイバ束による光学的手段で光学的に結合した点である。すなわち、ピンホール・ディスク3と対物レンズ7の間にリレーレンズ11と光ファイバ束12を介在させた点である。

【0013】さらに詳しく述べると次の通りである。光ファイバ束12は複数の光ファイバ（これら光ファイバの一つ一つは、コアとその周囲を覆うクラッドから成る）を束ねたものであり、光ファイバ束の両端面のコア配置は鏡面対象となるように束ねられている。更にこの光ファイバは、中間部が変形自在で、適宜に捻めることのできるいわゆる可撓性のファイバである。

【0014】この光ファイバ12は、その端面が、ピンホール・ディスク3から出射された光がリレーレンズ11によって結像する面（結像面）と一致する位置に固定配置される。また光ファイバ12の下端面も対物レンズ7の焦点位置に来るように固定配置される。

【0015】ピンホール・ディスク3を回転させ光ビームを走査すると、光ファイバ束12を伝わって下端面から同様に走査される光ビームが出射される。出射した光ビームは対物レンズ7を透過して試料8面を走査する。

【0016】なお、光ファイバ束のコア径 c は、光ファイバ束端面上に照射された光のビーム径 a とほぼ等しいことが必要である。その理由を以下に述べる。

【0017】 $a > c$ であると、図2に示すように同時に複数のコアに光ビームが照射される。光ファイバ束端面では必ず図3に示すように発散光となっていることを考慮すると、図4に示すように試料8が焦点面にあるときも、図5に示すように試料8が焦点面から外れている場合でも、共焦点光スキャナでは端面 α に対してのみ共焦点スライス効果があるため同様に画像が得られてしまう。つまり、試料8に対しては共焦点のスライス像が得られないことになる。

【0018】光ビーム径 a とコア径 c がほぼ等しければ、図6に示すように光ファイバにはピッチ P だけ離れたコアにしか光が照射されず、また受光側にも戻らない。つまり、光ファイバのコアがピンホールと同等の働きをすることになる。コア径 c が光ビーム径 a より大幅に大きいと、図7に示すように複数の光ビームが同一のコアに入ってしまうため、やはり共焦点効果が得られない。結局、共焦点の効果を得るためには、 $0.5a \leq c \leq 2a$ 程度が限界である。

【0019】このような構成においては、従来と同様に

集光ディスク2に入射するレーザ光はマイクロレンズで絞られ、ビームスプリッタ6を透過してピンホールに集光する。ピンホールから出射された光はリレーレンズ11を経由して光ファイバ12の端面上に集束する。光ファイバ12の下面からはピンホールからと同等の光ビームが出射され、対物レンズ7に入射する。

【0020】対物レンズ7を通った光ビームは試料8面に集束する。試料8面からの戻り光は対物レンズ7を通過して光ファイバ12の下面に結像し、その像は光ファイバ12の上端に伝わる。すなわち、試料8面の像は光ファイバ12の上端面に現れ、この像はリレーレンズ11を介してピンホール面に結像する。

【0021】その後は従来と同様に、ビームスプリッタ6で反射され、集光レンズ9を介してカメラ10に入る。このような構成によれば、光ファイバ12が自在に変形できるため、光スキャナに対して試料8を任意の位置関係で観測することができる。

【0022】なお、以上の説明は、本発明の説明および例示を目的として特定の好適な実施例を示したに過ぎない。したがって本発明は、上記実施例に限定されることがなく、その本質から逸脱しない範囲で更に多くの変更、変形を含むものである。

【0023】例えば、スキャナ側の微小開口部はピンホールではなく、スリットでもよい。このとき、上記コア径の制限は開口部の最小寸法であり、共焦点効果を生じるスリット幅 b に対して必要条件となる。

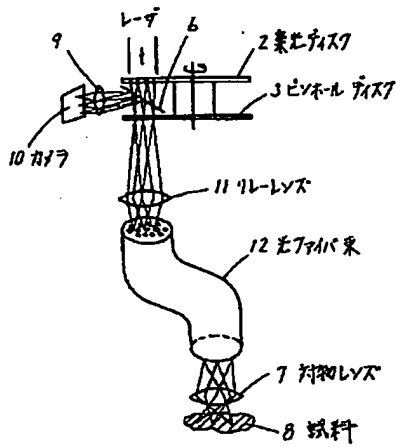
【0024】また、光軸方向のスライス画像を得る部位を変えるには、例えば図8に示すように、光ファイバ束12の下端部に例えば円筒形のホルダ21を取り付け、このホルダ21内に対物レンズ7を光軸方向に動かす手段、例えばアクチュエータ22を設ける等が有用である。このような機構によれば、容易にスライス画像を得る部位を微妙に変えることができる。

【0025】なお、アクチュエータとしてはピエゾ素子や電磁式でもよく、駆動信号は光ファイバと同軸に組み込んだ電線で供給するのが望ましい。なお、共焦点で高倍率観察を行う場合は、図8に示すようにホルダ21の先端に光が透過できるガラス等の材料で形成された窓23を設け、それを試料（患部等）に押し当てて光走査を行えば安定な測定が可能となる。

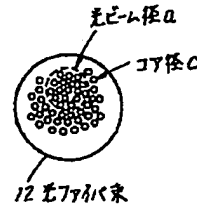
【0026】また、癌等は蛍光試薬が集中しやすく、患部をレーザ光で焼くことが行われている。このためには前記観察用のレーザ光以外に図9に示すような治療用のレーザ光24を光ファイバ束と同軸で導入することができる。両者の波長を変え、観察側では治療用のレーザ光をフィルタでカットするようしておけば、治療しながら観察することもできる。なお、癌細胞は表層から数層内部にある場合があり、共焦点スライスは大変有効である。

【0027】また、本発明は内視鏡だけでなく、携帯型

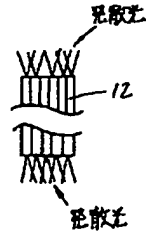
【図1】



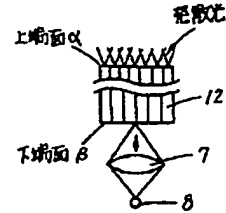
【図2】



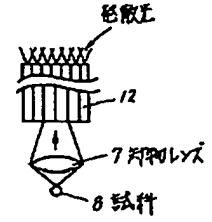
【図3】



【図4】



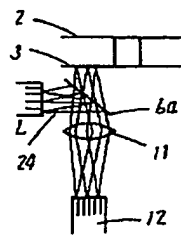
【図5】



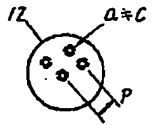
【図10】



【図9】



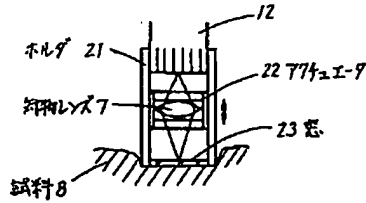
【図6】



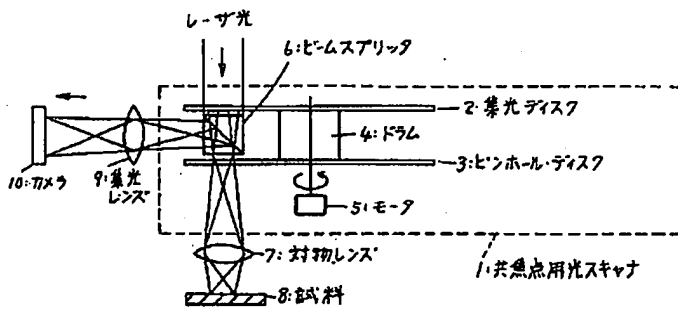
【図7】



【図8】



【図11】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☒ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.